

# Mikroskopische Untersuchungen

TechnoLab präsentierte auf der SMT in Nürnberg Neuerungen und bewährte Analyseverfahren für das Aufspüren von Fehlerursachen an Leiterplatten, elektronischen Baugruppen, Komponenten und Materialien.

## Produktbericht

Im Fokus stand unter anderem ein Mikroskopisches Testverfahren: Das zur Demonstration verwendete Mikroskop Typ Leica DM2700 ist ein aufrechtes Materialmikroskop mit einer bis 1000-fachen Vergrößerung. Ein entsprechendes Gerät verwendet das Unternehmen zur Bewertung metallografischer Präparate. Angeschlossen ist eine Kamera MC190HD.

Zudem stand die Fourier-Transform-Infrarot-Spektroskopie (FTIR) im Mittelpunkt: Für Interessenten wurden Anwendungen der FTIR-Analyse und der FTIR-Mikroskopie zur Identifizierung organischer Materialien, wie z.B. Kunststoffteilen, Flüssigkeiten oder Rückständen, und zur Fehleranalyse an elektronischen Baugruppen und Komponenten vorgestellt.  
(mrc)



Schadgastest nach IEC 60068-2-60 zur Prüfung elektronischer Baugruppen.  
(Bild: TechnoLab)

## Newsletter

Das Neueste von **all-electronics** direkt in Ihren Posteingang!

## ● WEITERE INFOS

TechnoLab GmbH

Wohlrabedamm 13

13629 Berlin

Deutschland

[Zum Firmenprofil >](#)